سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
محاسبه خواص اپتیکی لایه های نازک اکسید روی به دو روش مختلف اسپکتروسکوپی الیپسومتری و کرامرز- کرونیگ

محل انتشار:
چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:
مریم مطلبی اقگنبد - *دانشجوی دکترا، دانشگاه ارومیه*

حسن صدقی - *استاد، دانشگاه ارومیه*

خلاصه مقاله:
لایه های نازک اکسید روی به روش سل- ژل با سرعت انباشت 3600 دور در دقیقه در دمای اتاق ساخته شدند. بلافاصله بعد از لایه نشانی لایه ها در دمای C˚200 به مدت 10 دقیقه حرارت دیدند. سپس لایه ها به مدت یک ساعت در دمای C˚500 بازپخت شدند. ضرایب بازتاب برای لایه ها با استفاده از دستگاه اسپکتوسکوپی الیپسومتری در زاویه فرود 70 درجه بدست آمدند. خواص اپتیکی لایه های نازک اکسید روی از جمله ضریب شکست و ضریب خاموشی به دو روش مختلف اسپکتروسکوپی الیپسومتری و کرامرز کرونیگ محاسبه شد. گاف نواری انرژی نیز برای لایه های تهیه شده بدست آمد.

کلمات کلیدی:
اکسید روی، لایه نازک، خواص اپتیکی، اسپکتروسکوپی الیسومتری، کرامرز- کرونیگ

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/587402